

**MKS、生産環境における高精度ビームコースティックおよびプロファイリング用  
Ophir® BeamSquared® SP204S-PRO  
M<sup>2</sup>レーザービームアナライザーを発表**

**Ophir BeamSquared ファミリーには、高繰返しレーザーの計測用高解像度ビームプロファイラーも追加されました。これにより、通信、医療機器、自律走行車両などの分野で使用可能です。**

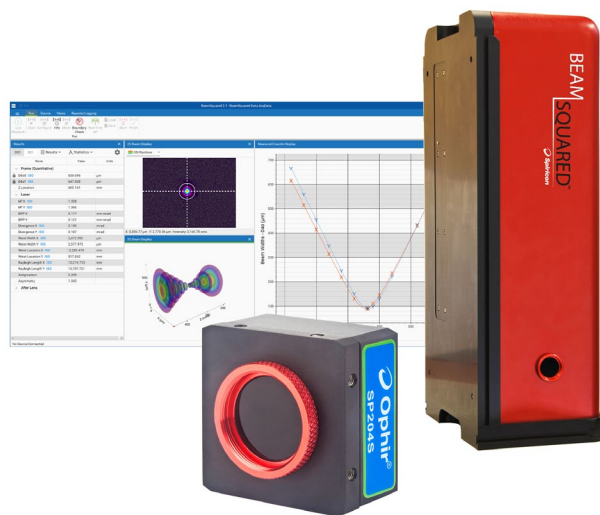
マサチューセッツ州アンドーバー - 2025年1月29日 - 世界を変革する技術を提供するグローバルプロバイダーである MKS Instruments, Inc. (NASDAQ : MKSI) は、Ophir® BeamSquared® SP204S-PRO および Ophir® BeamSquared® SP1203 M<sup>2</sup>ビームアナライザーを SPIE の Photonics West 2025 にて発表します。

本製品は、株式会社オフィールジャパンが、日本国内にて販売いたします。

BeamSquared SP204S-PRO M<sup>2</sup>アナライザーは、半導体、ディスプレイ製造、医療システム、防衛、産業用途における先進的なレーザー製造向けの高精度ビームコースティックおよびプロファイリングシステムです。このコンパクトで完全自動化されたツールは、標準および大径の連続波 (CW) レーザーおよびパルスレーザーの伝搬特性を迅速かつ正確に測定します。拡張されたレイリー範囲 (最大 40 メートル) にも対応します。BeamSquared SP204S-PRO M<sup>2</sup>アナライザーは、高精度な生産環境において、M<sup>2</sup>、ウエスト位置、非点収差、およびビーム対称性などの主要なビームパラメータの正確な特性評価が必要なユーザー向けに設計されています。

このアナライザーは、Ophir BeamSquared シリーズの新製品であり、大径ビームのウエスト位置測定的大幅な改善および非点収差測定精度 3%を達成しており、先進的な光学システムの最適化に重要です。BeamSquared SP204S-PRO M<sup>2</sup>アナライザーは、より高い精度のビーム伝搬および品質パラメータを提供し、レーザーパラメータ測定の機器間の一貫性を維持します。これらの特長は、継続的な生産環境において重要です。

BeamSquared M<sup>2</sup>ビームアナライザーファミリーには、Ophir SP1203 GigE カメラを搭載した BeamSquared® SP1203 アナライザーも追加されました。



この高解像度ビームプロファイラーは、より小さなビーム径のレーザー（SWIR および NIR 範囲で最大 150  $\mu\text{m}$ ）の正確な測定が可能で、より長いレイリー長を持ち、より狭いスポットに焦点を合わせる必要がある場合に適しています。これにより、BeamSquared SP1203 M<sup>2</sup> システムは、通信、先進的な製造（溶接、切断、3D プリント）、自律走行車両（LiDAR）、および医療機器（眼科および光干渉断層撮影）などの幅広い先進的な用途で使用できます。

「最先端レーザーシステムの進化により、トップメーカーは厳しい顧客の要求に応えるために、より正確な性能検証方法を求めるようになりました」と、Ophir Photonics Products のジェネラルマネージャーである Reuven Silverman 氏は述べています。「メーカーは、非点収差やウエスト位置測定の大きな誤差、UV から NIR スペクトルにわたる品質管理に苦慮していました。新しい BeamSquared M<sup>2</sup> アナライザーは、これらの懸念に対応します。ISO11146 準拠、正確なビームコースティック測定、拡張されたレーザー特性評価機能を組み合わせ、市場で最も正確な製品を提供します。これにより、連続プロセスの製造業者は、最適な精度と信頼性でレーザーを調整することが可能になります。」

BeamSquared M<sup>2</sup> アナライザーには、Ophir BeamSquared ソフトウェア、光学系、および高解像度カメラが含まれています。最新のアナライザーは、より長い光学系と特許取得済みの UltraCal™ 高度キャリブレーションソフトウェアを備え、最大 40 メートルのレイリー範囲を持つレーザーの高精度ビーム解析を実現します。このソフトウェアは、X 軸および Y 軸の両方でビームの伝搬特性を測定し、ウエスト径、全角での拡がり角、ウエスト位置、レイリー長、M<sup>2</sup> または K および BPP ファクター、非点収差、非対称性などを含みます。システムは、焦点を通るビームの挙動を視覚的に確認するための 2D または 3D ビームプロファイルを表示します。機能には 3D スライス表示や、レポートに 3D 表示を追加する機能が含まれます。レポートには、設定情報、レーザー測定、さまざまな統計データに加えて、ビームコースティックチャートを組み込むことができます。 .Net コンポーネントを介した自動化インターフェースにより、ユーザーは BeamSquared システムのレーザービーム解析および処理能力を組み込んだカスタムアプリケーションを構築することが可能です。

すべての BeamSquared M<sup>2</sup> アナライザーは、作業スペースの最適化のために水平または垂直に設置することができます。各アナライザーには、400~1000 mm の従来の集光レンズが装備されています。BeamSquared SP204S-PRO アナライザーには、特に長いレイリー範囲のレーザー（40 メートル）で使用するために最適に設計された特別校正済みレンズが装備されており、長いウエスト位置と大きなビームを伴う場合に適しています。

Ophir BeamSquared SP204S-PRO および Ophir BeamSquared SP1203 M<sup>2</sup> ビームアナライザーの購入につきましては、下記までご相談ください。

・Ophir BeamSquared SP204S-PRO データシート

<https://www.ophiropt.com/ja/f/beamsquared-pro-m2-beam-analyzer>

・Ophir BeamSquared SP1203 データシート:

<https://www.ophiropt.com/ja/f/beamsquared-sp1203-m2-beam-analyzer>

販売に関するお問い合わせ：(株)オフィールジャパン レーザー計測機器部 [oj.sales@mksinst.com](mailto:oj.sales@mksinst.com)

### **MKS Instruments について**

MKS Instruments, Inc は、世界を変革する技術を提供しています。最先端の半導体製造、エレクトロニクスおよびパッケージング、特殊産業アプリケーション向けに基盤技術ソリューションを提供し、幅広い科学技術およびエンジニアリングの能力を活用して、プロセス性能の向上、生産性の最適化、独自のイノベーションを実現する機器、サブシステム、システム、プロセス制御ソリューション、特殊化学技術を創出しています。当社のソリューションは、先進的なデバイス製造におけるミニチュア化と複雑性の課題に対応し、出力の増加、速度の向上、機能の強化、接続性の最適化を可能にします。また、さまざまな特殊産業アプリケーションにおける高まる性能要件に対応するためにも不可欠です。

詳細については [www.mks.com](http://www.mks.com) をご覧ください。

### **Ophir ブランドについて**

Ophir は、MKS Instruments、Photonics Solutions 部門のブランドです。(株)オフィールジャパンは Ophir 製品を国内販売する子会社です。Ophir 製品ポートフォリオには、レーザーおよび LED 測定製品が含まれており、レーザーパワーメーターとエネルギーメーター、フェムトワットから数百キロワットのレーザーを測定するレーザービームプロファイラー、高性能な赤外線および可視光学要素、防衛および産業用途向けの赤外線サーマルイメージングレンズおよびズームレンズ、CO<sup>2</sup> および高出力ファイバーレーザー材料加工用途向けの OEM および交換用高品質光学部品およびサブアセンブリが含まれます。

Ophir 製品は、半導体、エレクトロニクスおよびパッケージング、特殊産業市場において、お客様の能力と生産性を向上させます。詳細については、[www.ophiropt.com](http://www.ophiropt.com) をご覧ください。

### **本件に関するお問い合わせ**

株式会社オフィールジャパン

マーケティングコミュニケーションズ：岩室 奈美

TEL: 03-3556-2705

E-mail: [oj.marcom@mksinst.com](mailto:oj.marcom@mksinst.com)

URL: [www.ophiropt.com/](http://www.ophiropt.com/)